

Title (en)

Method and device for automatically recognising errors on workpieces

Title (de)

Verfahren und Vorrichtung zur automatisierten Fehlererkennung an Werkstücken

Title (fr)

Procédé et dispositif de reconnaissance automatisée d'erreur sur des pièces

Publication

**EP 3040713 A1 20160706 (DE)**

Application

**EP 14200549 A 20141230**

Priority

EP 14200549 A 20141230

Abstract (en)

[origin: WO2016107732A1] The invention relates to a method for automated error detection in workpieces (26) by means of an X-ray testing system (2) comprising an X-ray radiation source (6) and an X-ray radiation detector (8), in which method: the X-ray testing is carried out in a defined position of the workpiece (26) between the X-ray radiation source (6) and the X-ray radiation detector (8); and the workpiece position is optically detected and a deviation from the defined position is determined. In the process, the X-ray radiation source (6) and the X-ray radiation detector (8) are moved according to the detected deviation until the workpiece (26) is arranged in the defined position between the X-ray radiation source (6) and the X-ray radiation detector (8).

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur automatisierten Fehlererkennung in Werkstücken (26) mittels einer Röntgenprüfanlage (2) mit einer Röntgenstrahlenquelle (6) und einem Röntgenstrahlendetektor (8), bei welchem die Röntgenprüfung in einer definierten Stellung des Werkstücks (26) zwischen der Röntgenstrahlenquelle (6) und dem Röntgenstrahlendetektor (8) erfolgt und bei welchem die Werkstückstellung optisch erfasst und eine Abweichung von der definierten Stellung ermittelt wird. Hierbei werden die Röntgenstrahlenquelle (6) und der Röntgenstrahlendetektor (8) entsprechend der ermittelten Abweichung so verfahren, bis das Werkstück (26) in der definierten Stellung zwischen der Röntgenstrahlenquelle (6) und dem Röntgenstrahlendetektor (8) angeordnet ist.

IPC 8 full level

**G01N 23/18** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**G01N 23/083** (2013.01 - EP US); **G01N 23/18** (2013.01 - EP US); **G01N 2223/3303** (2013.01 - EP); **G01N 2223/643** (2013.01 - EP); **G01N 2223/6466** (2013.01 - EP)

Citation (applicant)

EP 1717573 A2 20061102 - YXLON INT X RAY GMBH [DE]

Citation (search report)

- [X] US 5541856 A 19960730 - HAMMERMEISTER DAVID W [US]
- [XI] DE 1252939 B 19671026 - CARL KUETTNER SCHWINGTECHNIK D, et al
- [XI] US 2008298538 A1 20081204 - WEN KUANG PU [TW], et al
- [XI] DE 19855213 A1 20000629 - SIEMENS AG [DE]
- [A] US 5848118 A 19981208 - GOUKASSIAN SAMVEL [US]
- [A] EP 2326941 A1 20110601 - GE SENSING & INSPECTION TECH [DE]
- [A] DE 102011003653 A1 20120809 - SIEMENS AG [DE]

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

**EP 3040713 A1 20160706; EP 3040713 B1 20180404; EP 3040713 B2 20210804; WO 2016107732 A1 20160707**

DOCDB simple family (application)

**EP 14200549 A 20141230; EP 2015079655 W 20151214**